

บทที่ 5

อภิปรายและสรุปผล

บทนี้เป็นการอภิปรายและสรุปผลการศึกษางานวิจัยประกอบด้วย ผลของกระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียม และผลของอัตราไหลแก๊ส ต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

อภิปราย

ผลของกระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียม

ฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ชุดนี้เคลือบบนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอนด้วยเทคนิครีแอคทีฟแมกนีตรอน โศปัดเตอริง โดยกำหนดให้กระแสไฟฟ้าของเป้าออกไซด์ไทเทเนียมคงที่เท่ากับ 300 mA และแปรค่ากระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมเท่ากับ 300 mA, 600 mA และ 900 mA ตามลำดับ ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า เกิดฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ทุกเงื่อนไขการเคลือบ ส่วนนี้เป็นการอภิปรายผลของกระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมต่อโครงสร้างผลึก ค่าคงที่แลตทิซ ขนาดผลึก ความหนา ลักษณะพื้นผิว องค์ประกอบธาตุและโครงสร้างจุลภาคของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์

1. โครงสร้างผลึก

ผลการศึกษาโครงสร้างผลึกของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ที่ได้ด้วยเทคนิค XRD พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 36.76° , 42.84° , 62.18° และ 56.50° โดยฟิล์มที่เคลือบได้ มีโครงสร้างผลึกระนาบ (111), (200) และ (220) ตามลำดับ โดยมีระนาบ (200) เป็น Preferred Orientation สอดคล้องกับงานวิจัยของ Musil and Hruby (2000) ที่พบว่าฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ ด้วยวิธีแมกนีตรอนสปัตเตอร์ มีโครงสร้างผลึกแบบ NaCl (เฟส เซ็นเตอร์ คิวบิก) พบว่า ที่ระนาบ (200) มีความเข้มการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์สูงสุด แต่ต้องให้ความร้อนแก่วัสดุรองรับขณะเคลือบสูงถึง 400°C อย่างไรก็ดีงานวิจัยนี้ สามารถเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ที่มีความเป็นผลึกได้ โดยไม่ต้องให้พลังงานความร้อนเพิ่มเติมแก่วัสดุรองรับ เนื่องจากในงานวิจัยนี้ เคลือบด้วยระบบโศปัดเตอริงแบบอเนกบาลานซ์ที่มีสนามแม่เหล็กสูง ส่งผลให้อะตอมของสารเคลือบมีพลังงานสูง จึงเกิดฟอร์มตัวเป็นฟิล์มที่มีความเป็นผลึกสูงได้ โดยไม่ต้องให้พลังงานเพิ่ม

จากผลของ XRD พบว่าฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ ที่ศึกษาในงานวิจัยนี้มีโครงสร้างผลึกแบบเฟส เซ็นเตอร์ คิวบิก เมื่อนำมาคำนวณหาค่าคงที่แลตทิซพบว่าไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ มีค่าคงที่แลตทิซลดลงเมื่อเทียบกับไทเทเนียมในไตรด์ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 381420 (4.241 Å) แต่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับออกไซด์ในไตรด์ ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 882250 (3.938 Å) เมื่อกระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมเพิ่มขึ้นจาก 300 mA เป็น 900 mA แล้วค่าคงที่แลตทิซ ($a = b = c$) ของไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ ที่ระนาบ (200) มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 4.1759 Å เป็น 4.2093 Å เนื่องจากอะตอมของไทเทเนียมมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับอะตอมของออกไซด์ และเมื่อกระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมเพิ่มขึ้นทำให้อะตอมของสารเคลือบถูกสปัตเตอร์ออกมามากขึ้นทำให้มีโอกาสเข้าไปรวมเป็นไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์มากขึ้น

ส่วนขนาดผลึกของฟิล์ม จำนวนได้จากสมการของ Scherrer พบว่าฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ที่เคลือบด้วยกระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมเพิ่มขึ้นที่ระนาบ (200) พบว่าผลึกมีขนาดเพิ่มขึ้น โดยมีค่าในช่วง 20.6 nm ถึง 29.9 nm

2. ความหนา และลักษณะพื้นผิว

ความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ที่เคลือบด้วยกระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมต่าง ๆ พิจารณาจากเทคนิค AFM พบว่าความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มเปลี่ยนไปตามกระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมที่เพิ่มขึ้น โดยผิวหน้าของฟิล์มบางมีเกรนลักษณะเล็กกระจายทั่วผิวหน้าของฟิล์ม และเริ่มเกาะกลุ่มกันมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเมื่อกระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมเพิ่มขึ้น สำหรับความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มพบว่า เมื่อกระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมเพิ่มขึ้นจาก 300 mA เป็น 900 mA ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนาเพิ่มขึ้นจาก 67 nm เป็น 262 nm สอดคล้องกับงานวิจัยของ Buranawong, Witit-anun, Chaiyakun, Pokaipisit, and Limsuwan (2011) พบว่า ความหนาของฟิล์มขึ้นอยู่กับความหนาแน่นพลาสมาของไทเทเนียมและออกไซด์ จึงสามารถสรุปได้ว่า กระแสไฟฟ้าของเป้าสารเคลือบที่เพิ่มขึ้น ทำให้อะตอมของสารเคลือบหลุดออกมามากขึ้น จึงส่งผลให้ความหนาของฟิล์มเพิ่มขึ้น ในส่วนของความหยาบผิวพบว่า เมื่อกระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมเพิ่มขึ้นจาก 300 mA เป็น 900 mA ความหยาบผิวมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 1.4 nm เป็น 3.1 nm เนื่องจากเมื่อกระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมเพิ่มขึ้น อัตราการสปัตเตอร์ (Sputter Rate) เป้าสารเคลือบเพิ่มขึ้น ทำให้ได้อะตอมของสารเคลือบ (Deposition Atom) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราการเคลือบ (Deposition Rate) สูงขึ้นด้วย ซึ่งสุดท้ายทำให้อะตอมของสารเคลือบตกเคลือบไปบนผิววัสดุอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้ mobility ของอะตอมสารเคลือบลดลง จึงเกิดการเคลือบในลักษณะสามเหลี่ยมและความหยาบผิวมากขึ้น

3. องค์ประกอบธาตุของฟิล์ม

องค์ประกอบธาตุของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ที่กระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมต่าง ๆ พิจารณาจากเทคนิค EDX พบว่าสัดส่วนขององค์ประกอบของฟิล์มบางเปลี่ยนไปตามกระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมที่เพิ่มขึ้นคือ ไทเทเนียมมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 9.89% เป็น 23.82% ส่วนออกไซด์ลดลงจาก 24.20% เป็น 8.77 % ในขณะที่ไนโตรเจนมีค่าค่อนข้างคงที่อยู่ที่ในช่วง 65.91% - 69.74% สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ding-Fwu (1998) พบว่า องค์ประกอบธาตุของฟิล์ม ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นพลาสมาของไทเทเนียมและออกไซด์ จึงสามารถสรุปได้ว่า สัดส่วนขององค์ประกอบของฟิล์ม ขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ให้กับเป้าสารเคลือบ

4. โครงสร้างจุลภาคและลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม

ลักษณะ โครงสร้างจุลภาคและพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ที่ได้จากการศึกษาด้วยเทคนิค FE-SEM แสดงลักษณะภาคตัดขวางของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ ซึ่งพบว่าโครงสร้างของฟิล์มมีการจัดเรียงตัวเป็นแบบคอลัมน์ และเมื่อกระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมเพิ่มขึ้น ลักษณะของฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนาและความหยาบผิวมากขึ้น เนื่องจากกระแสไฟฟ้าของเป้าสารเคลือบที่เพิ่มขึ้น ทำให้อะตอมของสารเคลือบหลุดออกมามากขึ้น จึงส่งผลให้ฟิล์มมีความหนาเพิ่มขึ้น และทำให้อะตอมของสารเคลือบตกเคลือบไปบนผิววัสดุอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้ mobility ของอะตอมสารเคลือบลดลง จึงเกิดการเคลือบในลักษณะสามเหลี่ยม และมีความหยาบผิวมากขึ้น

ผลของอัตราไหลแก๊สในโตรเจน

ฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ชุดนี้เคลือบบนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอน ด้วยเทคนิคอีพอกซีเมกนีตรอน โครสปีดเตอริง โดยแปรค่าอัตราไหลแก๊สในโตรเจนเท่ากับ 4, 6 และ 8 sccm ตามลำดับ ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า เกิดฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ ทุกเงื่อนไขการเคลือบ ส่วนนี้เป็นการอภิปรายผลของอัตราไหลแก๊สในโตรเจนต่อโครงสร้างผลึก ค่าคงที่แลตทิซ ขนาดผลึก ความหนา ลักษณะพื้นผิว องค์ประกอบธาตุ และโครงสร้างจุลภาคของ ฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์

1. โครงสร้างผลึก

โครงสร้างผลึกของฟิล์มที่ศึกษา พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 36.76° , 42.84° , 62.16° และ 56.50° โดยฟิล์มบางที่เคลือบได้ มีโครงสร้างผลึกระนาบ (111), (200) และ (220) ตามลำดับ เมื่ออัตราไหลแก๊สในโตรเจนเพิ่มขึ้นพบว่า ที่ระนาบ (111) มีความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์สูงสุด ความเข้มของรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์เพิ่มขึ้น เมื่ออัตราไหลแก๊สในโตรเจนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาณไนโตรเจนมากขึ้น ทำให้มีโอกาสรวมกับไทเทเนียม และออกไซด์เป็นไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์มากขึ้น

จากผลของ XRD พบว่าฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ ในงานวิจัยนี้มีโครงสร้างผลึกแบบเฟส เซ็นเตอร์ คิวบิก เมื่อนำมาคำนวณหาค่าคงที่แลตทิซพบว่า ไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ มีค่าคงที่แลตทิซลดลงเมื่อเทียบกับไทเทเนียมในไตรด์ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 381420 (4.241 Å) เนื่องจากการแทนที่ของอะตอมออกไซด์ในไตรด์ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าไทเทเนียมในไตรด์ของไทเทเนียมในไตรด์ ทำให้ระยะห่างระหว่างระนาบของผลึกลดลง ค่าคงที่แลตทิซจึงลดลง และพบว่าฟิล์มที่เคลือบได้มีค่าคงที่แลตทิซเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับออกไซด์ในไตรด์ ตามฐานข้อมูล JCPDS เลขที่ 882250 (3.938 Å) เนื่องจากการแทนที่ของอะตอมไทเทเนียม ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าออกไซด์ในไตรด์ของออกไซด์ในไตรด์ ทำให้ระยะห่างระหว่างระนาบของผลึกเพิ่มขึ้น ค่าคงที่แลตทิซจึงเพิ่มขึ้น

2. ความหนา และลักษณะพื้นผิว

ความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์เคลือบที่อัตราไหลแก๊สในโตรเจนค่าต่าง ๆ พิจารณาจากเทคนิค AFM พบว่าความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางเปลี่ยนไปตามอัตราไหลแก๊สในโตรเจนที่เพิ่มขึ้น โดยผิวหน้าของฟิล์มบาง มีเกรนลักษณะปลายแหลมเกาะกลุ่มกันมีขนาดค่อนข้างใหญ่ทั่วผิวหน้าของฟิล์ม และมีขนาดเล็กลงสม่ำเสมอใกล้เคียงกันเมื่ออัตราไหลแก๊สในโตรเจนเพิ่มขึ้น สำหรับความหนา และความหยาบผิวของฟิล์มพบว่า เมื่อเคลือบด้วยอัตราไหลแก๊สในโตรเจนเพิ่มขึ้นจาก 4 sccm ถึง 8 sccm ฟิล์มบาง

ที่เคลือบได้มีความหนาและความหยาบผิวลดลงจาก 329 nm เป็น 262 nm และ 5.8 nm เป็น 3.2 nm ตามลำดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Fanghua, Nan, Lun, and Gayang (2005) พบว่าความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มลดลงตามความดันย่อยแก๊สไนโตรเจนที่เพิ่มขึ้น เมื่อแก๊สไนโตรเจนเพิ่มมากขึ้นทำให้อัตราเคลือบของไทเทเนียมและอลูมิเนียมเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงไอออนของอาร์กอนและไอออนของไนโตรเจน ส่งผลให้อัตราการสปีดเตอร์ลดลง เนื่องจากที่แก๊สไนโตรเจนสูง ๆ จะเกิดสารประกอบไนไตรด์ที่หน้าเป่าสารเคลือบ หรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์ poisoning ทำให้เป่าถูกสปีดเตอร์ได้ยากขึ้น ส่งผลให้อะตอมของสารเคลือบตกลงบนวัสดุรองรับน้อยลง ทำให้ฟิล์มมีความหนาลดลง จากการศึกษาผลของอัตราไหลแก๊สไนโตรเจน พบว่าอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนมีผลต่อโครงสร้างและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Fanghua et al. (2005) ที่พบว่าโครงสร้างและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มเปลี่ยนตามความดันย่อยแก๊สไนโตรเจน

3. องค์ประกอบธาตุของฟิล์ม

องค์ประกอบธาตุของฟิล์มบางไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ ที่เคลือบด้วยอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนที่เพิ่มขึ้น พิจารณาจากเทคนิค EDX พบว่าสัดส่วนขององค์ประกอบธาตุฟิล์มบางไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนที่ใช้ในการเคลือบ โดย ไทเทเนียม อลูมิเนียม และไนโตรเจนมีค่าอยู่ในช่วง 22.91%-25.69%, 8.77%-9.88% และ 64.43%-67.41% ตามลำดับ เนื่องจากอัตราการเคลือบฟิล์มค่อนข้างคงที่ จึงสามารถสรุปได้ว่า อัตราไหลแก๊สไนโตรเจนไม่ส่งผลต่อองค์ประกอบธาตุของฟิล์มบางไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์

สรุปผลการทดลอง

1. फिल्मไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ ที่กระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมต่าง ๆ มีโครงสร้างผลึกแบบเฟซ เซ็นเตอร์ คิวบิก มีความเป็นผลึกเพิ่มขึ้น โดยพบว่ากระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมมีผลต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์
2. ความหนาและความหยาบผิวฟิล์มเพิ่มขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมเพิ่มขึ้น โดยพบว่ากระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมมีผลต่อลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์
3. องค์ประกอบธาตุของฟิล์ม พบว่าไทเทเนียมเพิ่มขึ้นตามกระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียม และออกไซด์ลดลง ส่วนไนโตรเจนมีค่าค่อนข้างคงที่ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่ากระแสไฟฟ้าของเป้าไทเทเนียมมีผลต่อองค์ประกอบธาตุของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์
4. โครงสร้างของชั้นฟิล์มไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์มีการจัดเรียงตัวแบบคอลัมน์
5. फिल्मไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ ที่อัตราไหลแก๊สไนโตรเจนค่าต่าง ๆ พบว่ามีโครงสร้างผลึกแบบเฟซ เซ็นเตอร์ คิวบิก มีความเป็นผลึกเพิ่มขึ้น โดยพบว่าอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนมีผลต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์
6. ความหนาและความหยาบผิวฟิล์มลดลงเมื่ออัตราไหลแก๊สไนโตรเจนเพิ่มขึ้น โดยพบว่าอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนมีผลต่อลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์
7. องค์ประกอบธาตุของฟิล์ม พบว่ามีค่าค่อนข้างคงที่เมื่ออัตราไหลแก๊สไนโตรเจนเพิ่มขึ้น สรุปได้ว่า องค์ประกอบธาตุของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์ในไตรด์ ไม่ขึ้นกับอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนที่ใช้ในการเคลือบ